

GPI XP/D™ GPI HS™ 规格



产品型号	
GPI XP/D	640 x 480 CCD 图像采集、相移式干涉测量法基本型
GPI HS	GPI XP/D 加强型。增强了 CCD 分辨率，可以更好地测量密条纹和大坡度表面
系统	
测量方法	激光 3 维相移干涉法
测量功能	精密测量各种不同反射面或光学面的形貌及特性
测量光束直径	4"(102 mm) 6"(152 mm)
配置	水平式, 立式向下或立式向上
光学中心线	4.25" (108 mm)
对准系统	快速条纹采样系统(QFAS) (双光点定位于十字线)
放大范围	6:1 (非连续式放大, 低失真)
调整可视范围	4": $\pm 3^\circ$ 6": $\pm 2^\circ$
光瞳调焦范围	GPI XP/D: -800 mm/+1600 mm @4" 孔径 GPI HS: -400 mm/ +1700 @4" 孔径
样件观察	GPI XP/D: 计算机实时显示/单独监视器 GPI HS: 附加条纹监视器
计算机	DELL PC; 配有硬盘, 光驱, 软驱, 17 英寸彩显, 可选配打印机
软件	Microsoft® Windows XP 专业版下的 ZYGO MetroPro™ 软件

尺寸与重量

尺寸(高 x 宽 x 长)	水平式 4": 308 x 694 x 308 mm
	水平式 6": 308 x 992 x 308 mm
	立式: H x 686x686 mm
重量	水平式 4": 36 Kg
	水平式 6": 41 Kg
	立式 4": 73 Kg
	立式 6": 77 Kg

性能参数

3 平板重复性 ¹	$\lambda/300 (2\sigma)$
RMS 重复性 ²	GPI XP/D: $\lambda/10,000 (2\sigma)$
	GPI HS: $\lambda/15,000 (2\sigma)$
数据采样	GPI XP/D: 640 x 480 像素, 8位
	GPI HS: 776 x 576 像素, 8位
	可选: 1K x 1K 像素
分辨率	$>\lambda/8,000$
条纹分辨率 ³	GPI XP/D: 180 条纹
	GPI HS: 220 条纹
数据采样时间	低分辨率(7幅数据图像):
	GPI XP/D: 93 ms
	GPI HS: 132 ms
	高分辨率(13幅数据图像)
	GPI XP/D: 173 ms
GPI HS: 244 ms	

环境要求

温度	15°C - 30°C (60°F - 95°F)
温度变化率	<1.0°C / 15 min
湿度	相对湿度 5% - 95%, 无凝结
防震	需要隔离 1-120Hz 的震动

电气要求

电源	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
气源	5.5 bar(干燥净化压缩空气, 减震系统需要)

如有变更, 恕不通知.

SS-0031 01/05

© 2005 Zygo Corporation

zygo

Zygo Corporation
Laurel Brook Road
Middlefield, CT 06455
Phone: 860-347-8506
Email: inquire@zygo.com
Website: www.zygo.com

美国翟柯公司 上海代表处
上海 淮海西路55号21E 200030
电话: 021-52989275 传真: 021-52989257
Email: info@zygo.com.cn
Website: www.zygo.com.cn

GPI XP/D™ GPI HS™ 规格

激光

类型	II 级 氦-氖激光
波长	632.8 nm
透光孔径输出功率	≤ 1 mw
光束偏振态	圆偏振。可选线偏振开关
相干长度	> 100 m

样件特性

材质	各种不同的玻璃、超精加工金属、陶和塑料
预处理	无需特殊处理，非接触、非破坏性测量，在现场环境中操作。
样件大小(高 x 宽 x 长)	254 x 203 x 203 mm (带2轴调整架)
样件重量	≤ 22.7 Kg (带 2 轴调整架)
反射率	0.1% - 100%

ZYGO 提供 大量多种的附件，包括：透射/反射平面标准参考镜头透射/反射球面标准参考镜头，样件固定配件，扩束器，曲率半径测量。

详情参考 *GPI and VeriFire Accessories booklet*, OMP-0463

注

- 1 三平板测试重复精度是该设备使用时的一个例子。平板 A 进行 6 次 3 平板测试；用平板 B、C、D、E 的 6 种组合再进行 3 平板测试，每组得到 16 个相平均值。这 6 个 3 平板测试中的 2σ 值即为重复精度。系统相对精度取决于参考面的质量。
- 2 重复性指每 100 个测量序列平均值相比的相同性，每个测量序列包含 16 次测量，其数值定义为 2σ 。
- 3 能够在 1X 放大时被仪器分辨出的样件图象中倾斜条纹的数目

SS-0031 01/05
© 2005 Zygo Corporation

如有变更,恕不通知.



Zygo Corporation
Laurel Brook Road
Middlefield, CT 06455
Phone: 860-347-8506
Email: inquire@zygo.com
Website: www.zygo.com

美国翟柯公司 上海代表处
上海 淮海西路55号21E 200030
电话: 021-52989275 传真:021-52989257
Email: info@zygo.com.cn
Website: www.zygo.com.cn